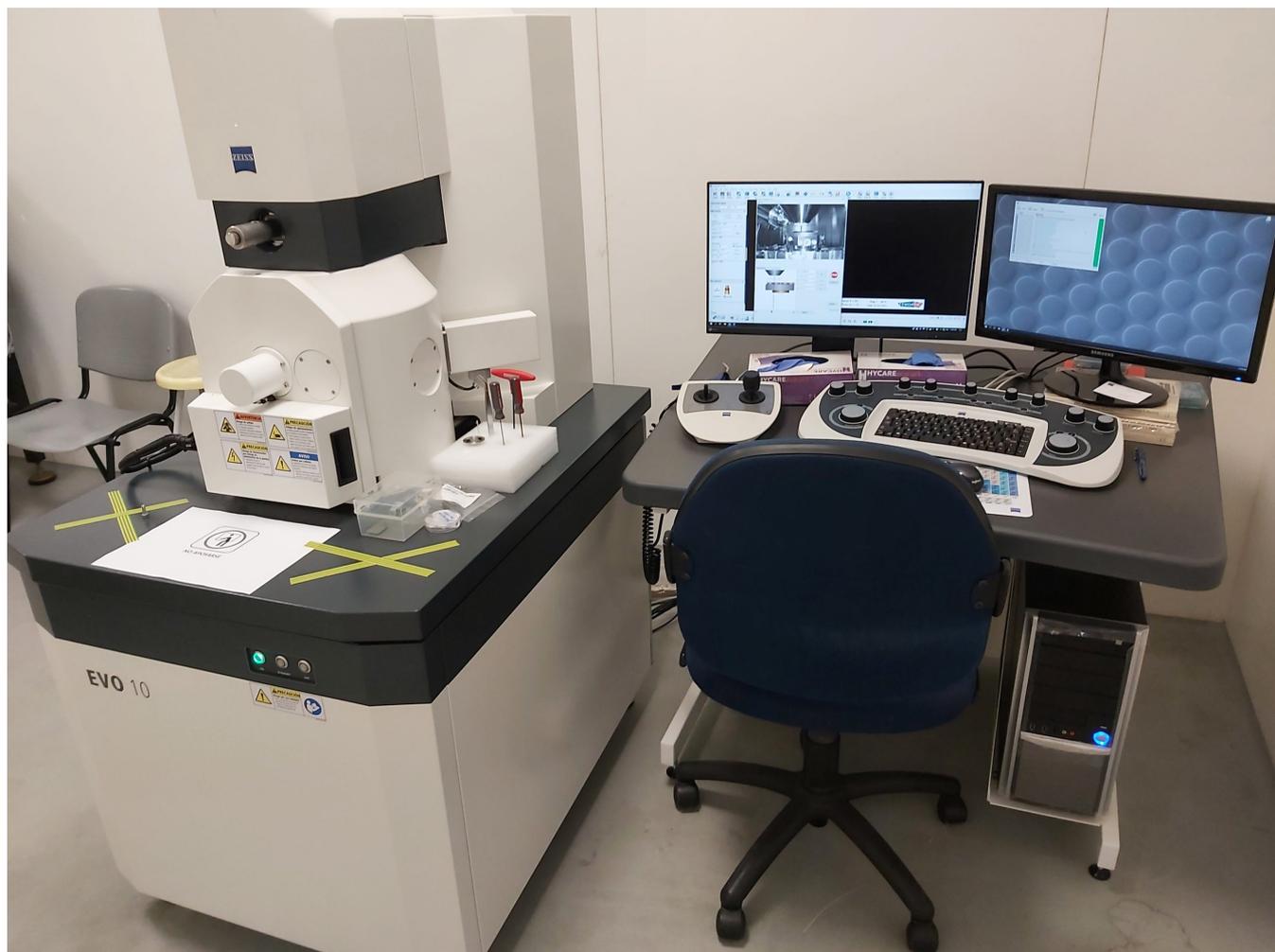


Servicio de microscopía electrónica

Análisis estructural de muestras de tamaño variado. Se analizan tanto muestras conductoras como aislantes. El recubrimiento metálico para muestras aislantes se puede solicitar adicionalmente.



Información de contacto

Dirección: Avda. Complutense 30,
Cemdatic, ETSIT, Edificio A

Teléfono: 910672367

Página web: cemdatic.upm.es

Correo electrónico: cemdatic@upm.es

- Disponible

Tipo de oferta tecnológica

Servicios científico - Tecnológicos

Áreas de investigación e innovación

- Ciencia para la ingeniería y la arquitectura

ODS



Disponible desde: 2021

¿Dónde?

Centro de Materiales y Dispositivos Avanzados para Tecnologías de Información y Comunicaciones (CEMDATIC)

Palabras clave: | [microscopía electrónica](#) | [SEM](#)

Servicio de microscopía electrónica

Descripción de los servicios que se ofrecen

Análisis de estructuras micrométricas y nanométricas en muestras de varios tamaños. Se pueden analizar muestras conductoras y aislantes. Para muestras aislantes se puede solicitar adicionalmente su recubrimiento metálico. El servicio se podría usar individualmente previo entrenamiento con el equipo.

Necesidades demandadas y aplicaciones

Análisis de estructuras nano- y micrométricas tanto conductoras como aislantes.

Sector o área de aplicación

Nanotecnología, Microtecnología.

Descripción del equipamiento

CEMDATIC, ETSI de Telecomunicación

Para dar este servicio se emplea un microscopio electrónico de barrido de sobremesa Zeiss EVO que permite: detección de electrones retrodispersados y secundarios; voltaje de aceleración desde 0.02kV hasta 30kV variable de forma continua en pasos de 10V; distancia analítica de trabajo de 8.5mm; corrientes desde 0.5pA hasta 5 uA; base motorizada en 5 ejes: X, Y, Z, tilt hasta 90° y rotación en 360°; cámara de muestras de 310mm de diámetro interno y 220mm de altura; escanear imágenes de hasta 32k x 24k píxel.

Solicitud del servicio

Solicitar servicio mediante correo electrónico a cemdatic@upm.es indicando fechas preferentes y experiencia en el uso de microscopios electrónicos de barrido.